カタログ等資料中の旧社名の扱いについて

2010年4月1日を以ってNECエレクトロニクス株式会社及び株式会社ルネサステクノロジが合併し、両社の全ての事業が当社に承継されております。従いまして、本資料中には旧社名での表記が残っておりますが、当社の資料として有効ですので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

ルネサスエレクトロニクス ホームページ (http://www.renesas.com)

2010年4月1日 ルネサスエレクトロニクス株式会社

【発行】ルネサスエレクトロニクス株式会社 (http://www.renesas.com)

【問い合わせ先】http://japan.renesas.com/inquiry



ご注意書き

- 1. 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。
- 2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。
- 3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。
- 4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用する場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損害に関し、当社は、一切その責任を負いません。
- 5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところにより必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。
- 6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するものではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合においても、当社は、一切その責任を負いません。
- 7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、データ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。

標準水準: コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、 産業用ロボット

高品質水準: 輸送機器(自動車、電車、船舶等)、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命 維持を目的として設計されていない医療機器(厚生労働省定義の管理医療機器に相当)

特定水準: 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器(生命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為(患部切り出し等)を行うもの、その他直接人命に影響を与えるもの)(厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当)またはシステム

- 8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件その他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用された場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。
- 9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生したり、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージング処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。
- 10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は、一切その責任を負いません。
- 11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお断りいたします。
- 12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご 照会ください。
- 注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレクトロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。
- 注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいいます。



MOS集積回路 **MOS Integrated Circuit**

7300画素×3列 カラーCCD リニア・イメージ・センサ

μPD3788は, CCD (Charge Coupled Device)によって走査をする,色分解と光から電圧への変換機能を持つ 7300画素×3列, 高速, 高感度の1次元カラー・イメージ・センサです。この製品は, 7300画素のフォトセル・アレ イを3列と,各画素列の信号電荷を偶数,奇数画素に分けて転送する電荷転送レジスタをそれぞれ2列持つ,各色2 出力方式を採用しています。また, µPD3728の色フィルタの分光特性(ハロゲン光源向き)を変更し,キセノン光源 に適した分光特性としています。そのため,600 dpi/A3対応の高速カラー・ディジタル・コピー機に最適です。

特 徴

有効画素数 :7300画素×3

フォトセル・ピッチ : 10 μ m

フォトセル・サイズ : 10 × 10 μ m²

ライン間距離 : 40 µ m (4 ライン) R (赤) 画素列 - G (緑) 画素列間 , G画素列 - B (青) 画素列間

色フィルタ : 赤色, 緑色, 青色の原色, 顔料系フィルタ 10⁷ lx・hourの耐光性あり

解像度 : 24 dot/mm (600 dpi) A3サイズ (297 x 420 mm) の短辺

入力クロック・レベル: +5 V動作のCMOS出力

データ・レート : 40 MHz MAX. (20 MHz / 1 出力)

出力方式 :同相2出力

電 源 : + 12 V単一電源

内蔵機能 : リセット・フィードスルー・レベル・クランプ回路

電圧アンプ

オーダ情報

オーダ名称 パッケージ

μ PD3788D 1 次元CCDセンサ用36ピン・セラミックDIP (15.24 mm (600))

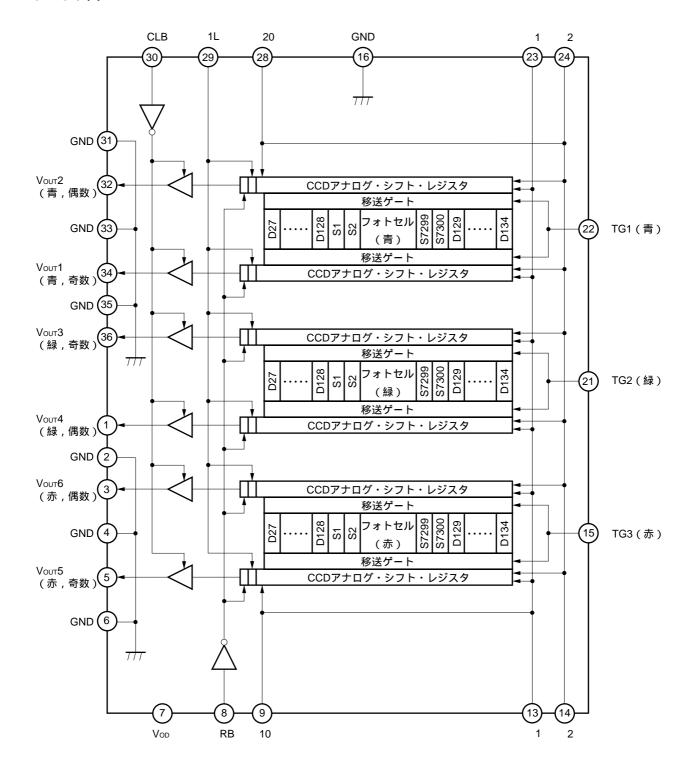
本資料の内容は、予告なく変更することがありますので、最新のものであることをご確認の上ご使用ください。



μPD3788とμPD3728**の相違点**

	項目			μ PD3788	μ PD3728
	シフト・レジスタ・クロック電風	Ξ(V)		- 0.3 ~ +8	- 0.3 ~ + 15
	リセット・ゲート・クロック電影	- 0.3 ~ +8	- 0.3 ~ + 15		
	リセット・フィードスルー・レベル・クラ	ンプ・クロック	ウ電圧(V)	- 0.3 ~ +8	- 0.3 ~ + 15
	移送ゲート・クロック電圧 (V)			- 0.3 ~ +8	- 0.3 ~ + 15
電気的特性	飽和露光量 (kvs)	赤	TYP.	0.36	0.35
		緑	TYP.	0.37	0.39
		青	TYP.	0.80	0.31
	感度 (V/lx・s)	赤	MIN.	3.85	3.9
			TYP.	5.5	5.6
			MAX.	7.15	7.3
		緑	MIN.	3.78	3.6
			TYP.	5.4	5.1
			MAX.	7.02	6.6
		青	MIN.	1.75	4.5
			TYP.	2.5	6.4
			MAX.	3.25	8.3
	感度ピーク (nm)	赤	TYP.	645	630
		緑	TYP.	540	540
		青	TYP.	445	460
	ランダム・ノイズ測定条件	t _{cp} = 20 ns	t7 = 150 ns		
タイミング・チャート	t3 (ns)		MIN.	17	20
	t7 (ns)		MIN.	17	20
	t10 (ns)		MIN.	- 20	- 10
	tcp (ns)		MIN.	5	-
			TYP.	150	-
標準特性曲線	総合分光感度特性			分光特性変更	-

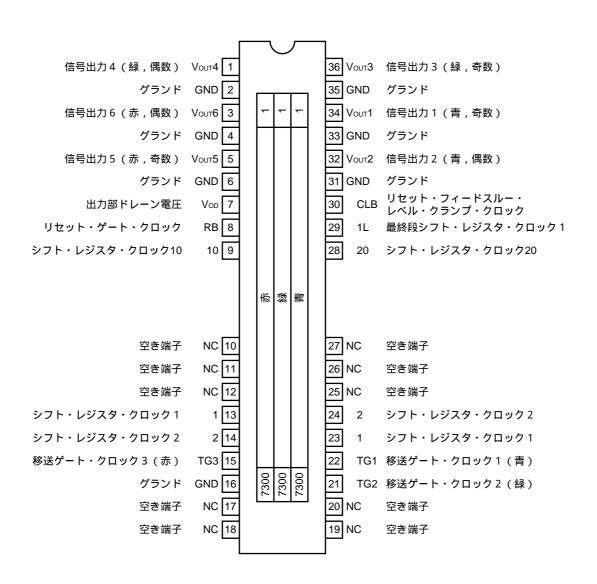
ブロック図



端子接続図 (Top View)

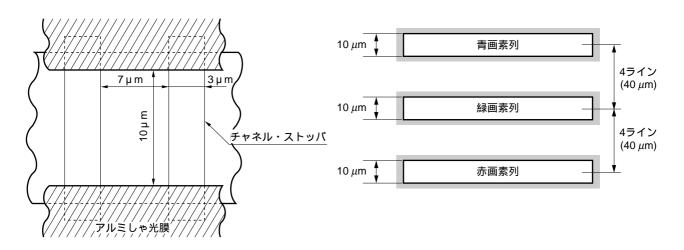
1次元CCDセンサ用36ピン・セラミックDIP (15.24 mm (600))

• μPD3788D



フォトセル構成図

画素列構成図(ライン間距離)





絶対最大定格 (TA = + 25)

項目	略号	定格	単 位
出力部ドレーン電圧	Vod	- 0.3 ~ + 15	V
シフト・レジスタ・クロック電圧	V 1 , V 1L , V 10 , V 2 , V 20	- 0.3~ +8	V
リセット・ゲート・クロック電圧	V RB	- 0.3~ +8	V
リセット・フィードスルー・レベル・クランプ・クロック電圧	V CLB	- 0.3 ~ +8	V
移送ゲート・クロック電圧	V TG1-V TG3	- 0.3 ~ +8	V
動作周囲温度	Та	- 25 ~ +60	
保存温度	T _{stg}	- 40 ~ + 100	

注意 各項目のうち1項目でも,また一瞬でも絶対最大定格を越えると,製品の品質を損なうおそれがあります。つまり絶対最大定格とは,製品に物理的な損傷を与えかねない定格値です。必ずこの定格値を越えない状態で,製品をご使用ください。

推奨動作範囲 (TA = + 25)

項目	略号	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
出力部ドレーン電圧	Vod	11.4	12.0	12.6	V
シフト・レジスタ・クロック・ハイ・レベル	V 1H , V 1LH , V 10H , V 2H , V 20H	4.5	5.0	5.5	V
シフト・レジスタ・クロック・ロウ・レベル	V 1L, V 1LL, V 10L, V 2L, V 20L	- 0.3	0	+ 0.5	V
リセット・ゲート・クロック・ハイ・レベル	V RBH	4.5	5.0	5.5	٧
リセット・ゲート・クロック・ロウ・レベル	V RBL	- 0.3	0	+ 0.5	V
リセット・フィードスルー・レベル・クランプ・	V сьвн	4.5	5.0	5.5	V
クロック・ハイ・レベル					
リセット・フィードスルー・レベル・クランプ・	V CLBL	- 0.3	0	+ 0.5	V
クロック・ロウ・レベル					
移送ゲート・クロック・ハイ・レベル ^注	V тg1н-V тg3н	4.5	V 1H	V 1H	V
			(V 10H)	(V 10H)	
移送ゲート・クロック・ロウ・レベル	V TG1L-V TG3L	- 0.3	0	+ 0.5	V
データ・レート	2f RB	-	2	40	MHz

注 移送ゲート・クロック・ハイ・レベル (V тG1H-V тG3H) がシフト・レジスタ・クロック・ハイ・レベル (V 1H(V 10H))より大きくなると残像が増加しますので注意してください。

備考 低,中速域(データ・レート 約24 MHz以下)で駆動する場合は,9番端子(10),28番端子(20)をオープンにした方が,クロック・ノイズの少ない出力波形を得られます。



電気的特性

【 T_A= +25 , V_{OD}= 12 V, f _{RB}= 1 MHz , データ・レート = 2 MHz , 蓄積時間 = 10 ms , 入力クロック = 5 V_{P-P} , 光源:3200 Kハロゲン・ランプ + C-500S(赤外カット・フィルタ , t = 1 mm) + HA-50(熱吸収フィルタ , t = 3 mm)

項 目		略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
飽和出力電圧		Vsat		1.5	2.0		V
飽和露光量	赤	SER			0.36		lx · s
	緑	SEG			0.37		lx · s
	青	SEB			0.80		lx · s
出力電圧の不均一性		PRNU	Vout = 1 V		6	18	%
平均暗時出力 ^{注 1}		ADS1	光入力しゃ断		1.0	5.0	mV
		ADS2	光入力しゃ断		0.5	5.0	
暗時出力不均一性 ^{注 1}		DSNU1	光入力しゃ断		2.0	5.0	mV
		DSNU2	光入力しゃ断		1.0	5.0	
消費電力		Pw			600	800	mW
出力インピーダンス		Zo			0.3	0.5	k
感度	赤	RR		3.85	5.5	7.15	V/lx · s
	緑	Rg		3.78	5.4	7.02	V/lx · s
	青	Rв		1.75	2.5	3.25	V/lx · s
残像 ^{注1}		IL1	Vout = 1 V		2.0	5.0	%
		IL2	Vout = 1 V		1.0	5.0	
オフセット・レベル ^{注2}		Vos		4.0	5.0	6.0	V
出力立ち下がり遅延時間 ^泊	£3	t d	Vout = 1 V		20		ns
レジスタ・インバランス		RI	Vout = 1 V	0		4.0	%
全転送効率		TTE	Vout = 1 V,	95	98		%
			データ・レート = 40 MHz				
感度ピーク	赤				645		nm
	緑				540		nm
	青				445		nm
ダイナミック・レンジ ^{注1}		DR11	Vsat/DSNU1		1000		倍
		DR12	Vsat/DSNU2		2000		
		DR21	Vsat/ bit1		2000		倍
		DR22	Vsat/ bit2		4000		
リセット・フィードスルー・ノイズ ^{注2}		RFTN	光入力しゃ断	- 500	+ 200	+ 500	mV
ランダム・ノイズ ^{注 1}		bit1	光入力しゃ断,画素クランプ時		1.0		mV
		bit2	(t _{cp} = 20 ns)		0.5		1
		line1	光入力しゃ断,ライン・クランプ時	-	4.0	-	1
		line2	(t19=3 µs)	-	2.0	-	1

注1. ADS1, DSNU1, IL1, DR11, DR21, bit1, line1はVouт1, Vouт2の値を示します。 ADS2, DSNU2, IL2, DR12, DR22, bit2, line2はVouт3-Vouт6の値を示します。

- 2.タイミング・チャート2,5参照。
- **3**. 1Lの立ち下がり時間t2[']が, TYP.のときの値です(**タイミング・チャート2,5**参照)。

6



入力端子容量(TA= +25 , VoD=12 V)

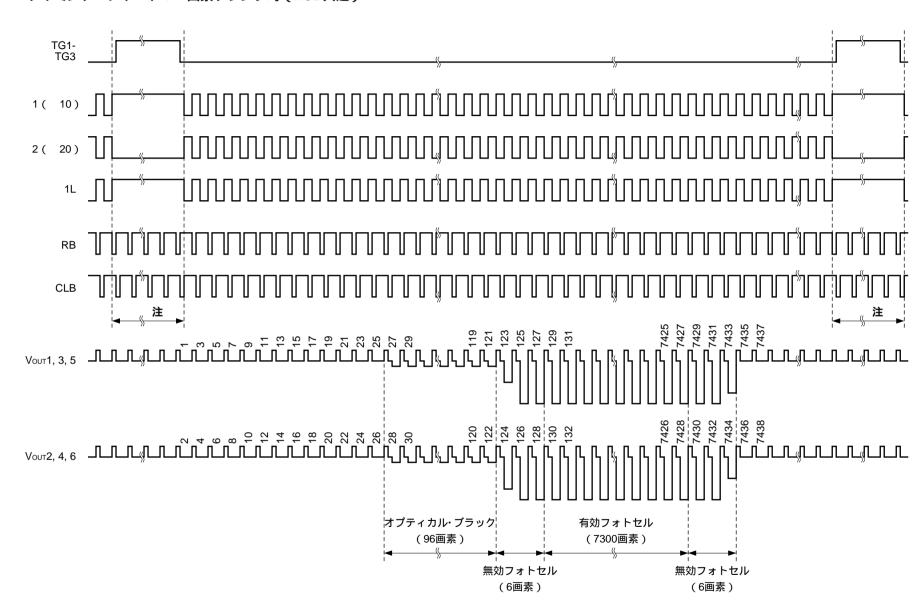
項目	略号	端子名称	端子番号	MIN.	TYP.	MAX.	単位
シフト・レジスタ・クロック端子容量 1	C 1	1	13		350	500	pF
			23		350	500	pF
		10	9		350	500	pF
シフト・レジスタ・クロック端子容量 2	C 2	2	14		350	500	pF
			24		350	500	pF
		20	28		350	500	pF
最終段シフト・レジスタ・クロック端子容量	С∟	1L	29		10		pF
リセット・ゲート・クロック端子容量	С вв	RB	8		10		pF
リセット・フィードスルー・レベル・クランプ・	C CLB	CLB	30		10		pF
クロック端子容量							
移送ゲート・クロック端子容量	Ст	TG1	22		100		pF
		TG2	21		100		pF
		TG3	15		100		pF

備考 13番端子と23番端子(1)と9番端子(10),14番端子と24番端子(2)と28番端子(20)はそれぞれこのICの内部でつながっています。

7

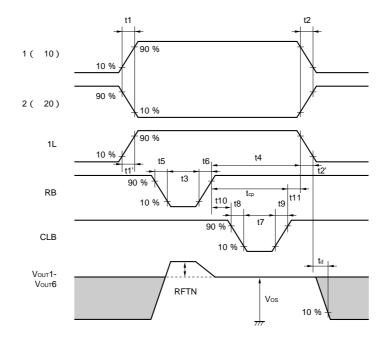
 ∞

タイミング・チャート1 画素クランプ時(RGB共通)



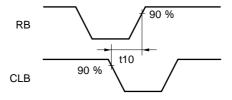
注 RB, CLBは,この期間も連続的にパルスを入力してください。

タイミング・チャート2 画素クランプ時(RGB共通)

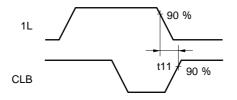


名 称	MIN.	TYP.	MAX.	単位
t1, t2	0	50		ns
t1', t2'	0	5		ns
t3	17	50		ns
t4	5	200	-	ns
t5, t6	0	20		ns
t7	17	150		ns
t8, t9	0	20		ns
t10	- 20 ^{注 1}	+ 50	-	ns
t11	- 5 ^{注 2}	+ 50		ns
tcp	5	150		ns

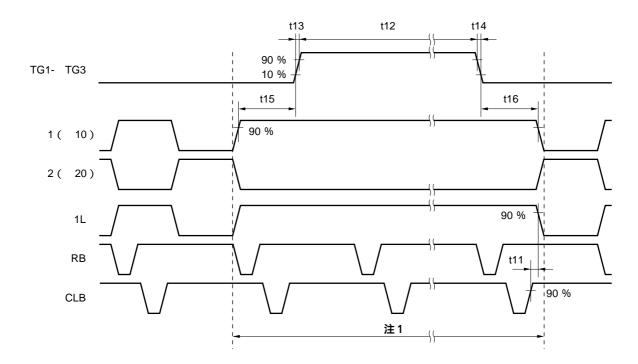
注1.t10のMIN.値は RBと CLBが,オーバラップしていることを示します。



2.t11のMIN.値は 1Lと CLBが,オーバラップしていることを示します。



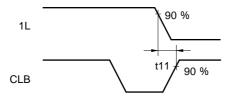
タイミング・チャート3 画素クランプ時(RGB共通)



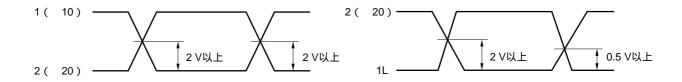
名 称	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
t11	-5 ^{注2}	+ 50		ns
t12	3000	10000		ns
t13, t14	0	50		ns
t15, t16	900	1000		ns

注1. RB, CLBは,この期間も連続的にパルスを入力してください。

2.t11のMIN.値は 1Lと CLBが,オーバラップしていることを示します。

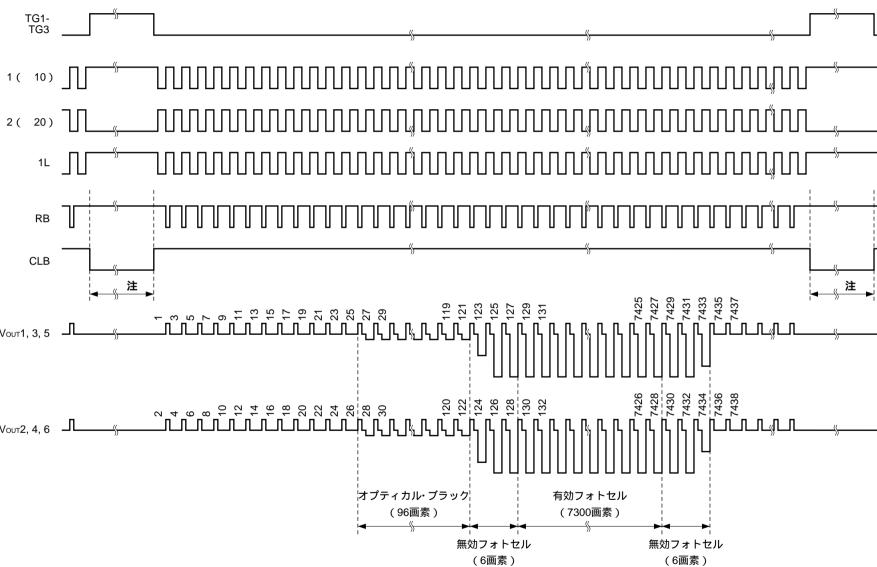


1 (10), 2 (20) クロス・ポイント 1L, 2 (20) クロス・ポイント



備考 (1(10), 2(20)),(1L, 2(20))のクロス・ポイントは,各端子の入力抵抗によ り調整してください。

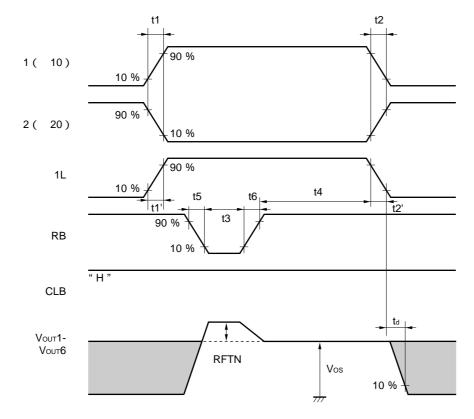
タイミング・チャート4 ライン・クランプ時(RGB共通)



注 この期間は, RBをハイ・レベルにしてください。

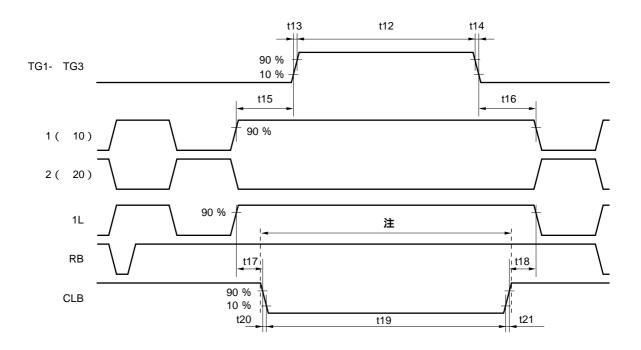
備考 CLBとして, TG1- TG3の反転パルスを用いることができます。

タイミング・チャート5 ライン・クランプ時 (RGB共通)



名 称	MIN.	TYP.	MAX.	単位
t1, t2	0	50		ns
t1', t2'	0	5		ns
t3	17	50		ns
t4	5	200	-	ns
t5, t6	0	20		ns

タイミング・チャート6 ライン・クランプ時(RGB共通)

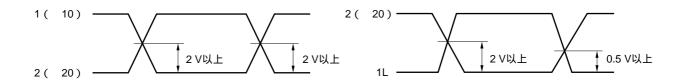


名 称	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
t12	3000	10000		ns
t13, t14	0	50		ns
t15, t16	900	1000		ns
t17, t18	100	1000		ns
t19	200	t12		ns
t20, t21	0	20		ns

注 この期間は, RBをハイ・レベルにしてください。

備考 CLBとして, TG1- TG3の反転パルスを用いることができます。

1 (10), 2 (20) クロス・ポイント 1L, 2 (20) クロス・ポイント



備考 (1(10), 2(20)),(1L, 2(20))のクロス・ポイントは,各端子の入力抵抗によ り調整してください。

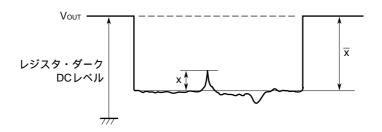
特性項目の定義

- **1.飽和出力電圧:** V_{sat} (Saturation Voltage) 感度の直線性が失われる出力信号電圧です。
- 2.飽和露光量: SE (Saturation Exposure)出力が飽和するときの照度(Ix)と蓄積時間(s)の積です。
- 3.出力電圧の不均一性: PRNU (Photo Response Non-uniformity) 感光面に照度が一様な光を当てたときの全有効画素の出力電圧量の不均一度です。次の式で表されます。

PRNU (%) =
$$\frac{x}{x} \times 100$$

 $x : |x_j - x|$ の最大値
 $\frac{\sum_{j=1}^{7300} x_j}{7300}$

xj:有効画素jの出力電圧



4.平均暗時出力:ADS (Average Dark Signal) 光入力しゃ断時の全有効画素の平均出力電圧です。次の式で表されます。

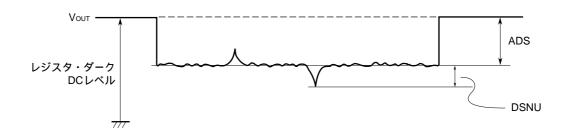
ADS (mV)=
$$\frac{\displaystyle\sum_{j\,=\,1}^{7300} d_j}{7300}$$

dj:有効画素jの暗時出力

5.暗時出力不均一性: DSNU (Dark Signal Non-uniformity)

光入力しゃ断時の全有効画素中で,最大もしくは最小出力画素の出力電圧とADSとの差の絶対値の最大値です。次の式で表されます。

DSNU (mV): | d_j - ADS | の最大値 j=1 ~ 7300 d_j: 有効画素 j の暗時出力



6. 出力インピーダンス: Zo (Output Impedance)

外から見たときの出力端子インピーダンスです。

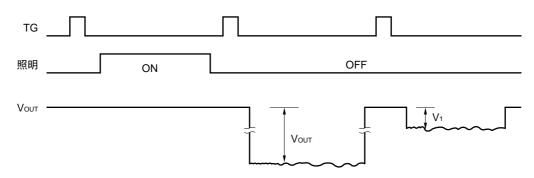
7.感度:R(Response)

出力電圧を露光量(Ix·s)で割ったものです。

感度の値は,使用する光源(分光特性)により変化します。

8.残像:IL (Image Lag)

1 ラインのデータを読み出したのち,次のラインの出力データに前回のラインの信号が残っている度合を示したものです。



IL (%) =
$$\frac{V_1}{V_{OUT}} \times 100$$

9. レジスタ・インパランス: RI (Register Imbalance)

感光面に照度が一様な光を当てたときに,奇・偶数画素出力の平均値の差と全有効画素の平均出力電圧との比をとっています。次の式で表されます。

RI (%)=
$$\frac{\frac{2}{n} \left| \sum_{j=1}^{\frac{n}{2}} (V_{2j-1} - V_{2j}) \right|}{\frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} V_{j}} \times 100$$

n :有効画素数

Vi:各画素ごとの出力電圧

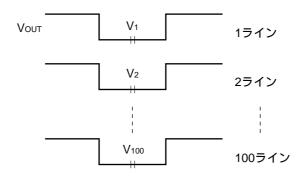
10. ランダム・ノイズ:

走査間で発生する,同一画素レベル変動の標準偏差です。

測定条件は暗時(光入力しゃ断時),サンプリング回数は100回(100走査)分です。次の式で表されます。

$$(mV) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{100} (V_i - \overline{V})^2}{100}}$$
 , $\overline{V} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} V_i$

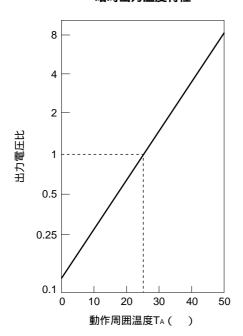
Vi: 各色で, 全有効画素中のある1画素の信号出力

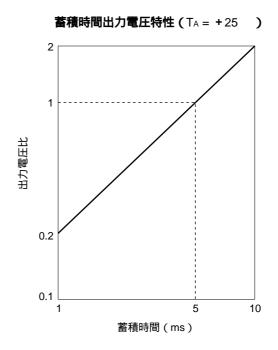


信号出力部のみをDCレベルで測定しており,相関2重サンプリング法は用いていません。

標準特性曲線(参考値)

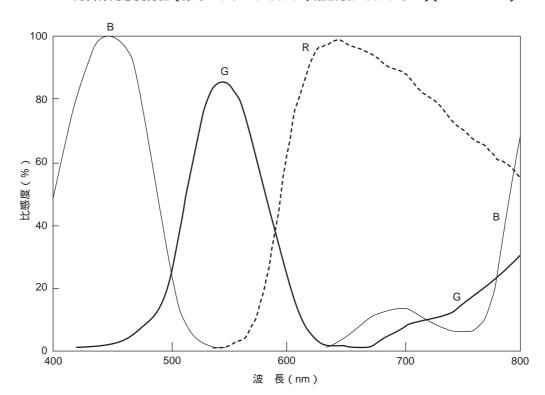
暗時出力温度特性



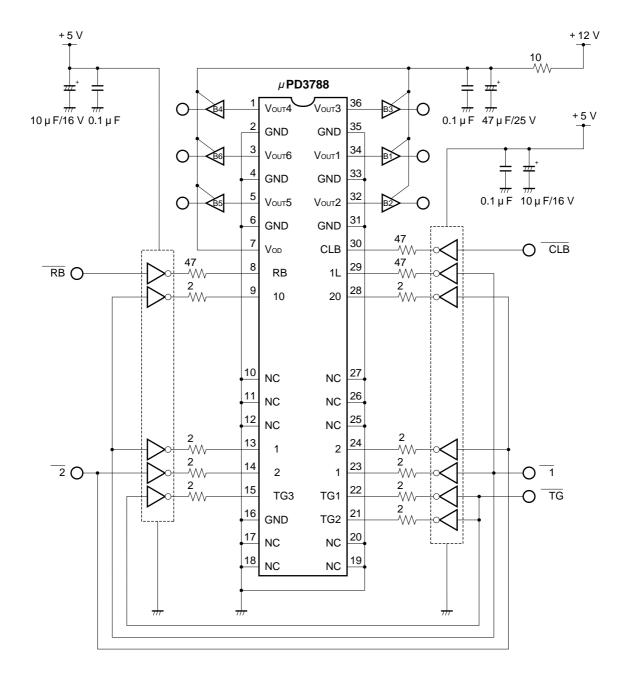


μ PD3788

総合分光感度特性 (赤外カット・フィルタ, 熱吸収フィルタなし)(TA = +25)

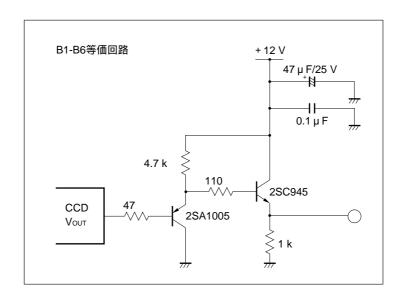


応用回路例



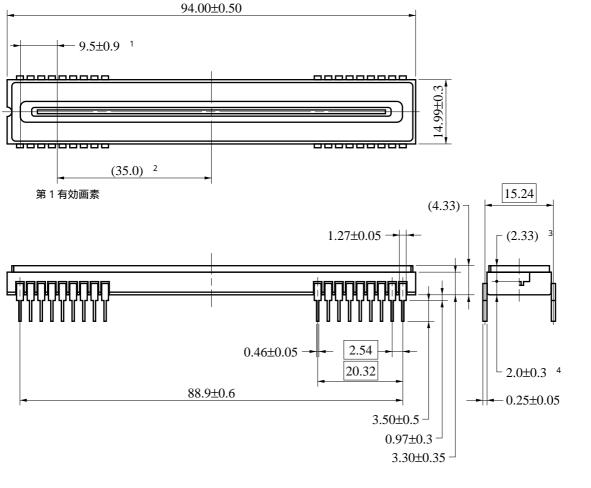
備考1.低,中速域(データ・レート 約24 MHz以下)で駆動する場合は,9番端子(10),28番端子(20)をオープンにした方が,クロック・ノイズの少ない出力波形を得られます。

2.回路図のインバータは,74AC04です。



外形図

1次元CCDセンサ用36ピン・セラミック DIP (15.24 mm (600))外形図(単位: mm)



名	称	寸	法	屈折率
ガラス・	キャップ	93.0 × 1	3.6 × 1.0	1.5

- 1 1ピンの中心から第1有効画素までの距離
- 2 パッケージ中心から第1有効画素までの距離(参考)
- 3 ガラス・キャップ上面からCCDチップ受光面までの距離(参考)
- 4 パッケージ底面からCCDチップ受光面までの距離

36D-1CCD-PKG1-2



パッケージ取り扱い上の注意事項

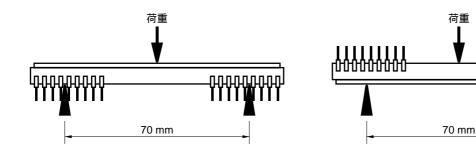
パッケージに過度の荷重が加わった場合,パッケージの反りや破断,内部チップの剥離などが発生する恐れがあります。基板への実装の際は十分注意してください。

実装の際は、パッケージに曲げ応力のかかりにくい基板を用いるか、ソケットを用いてください。

この製品の , 3 点曲げ強度 $^{\mathrm{i}}$ の参考値は300 [N] です。ただし , 窓材 (ガラス) のパッケージ本体 (セラミック部) との接着面より内側への荷重は避けてください。

注 3点曲げ強度試験方法

支点スパン: 70 mm, 支持部R: R2 mm, 荷重スピード: 0.5 mm/分



[メ モ]

CMOSデバイスの一般的注意事項

静電気対策 (MOS全般)

注意 MOSデバイス取り扱いの際は静電気防止を心がけてください。

MOSデバイスは強い静電気によってゲート絶縁破壊を生じることがあります。運搬や保存の際には、NECが出荷梱包に使用している導電性のトレーやマガジン・ケース,または導電性の緩衝材,金属ケースなどを利用し,組み立て工程にはアースを施してください。プラスチック板上に放置したり,端子を触ったりしないでください。

また,MOSデバイスを実装したボードについても同様の扱いをしてください。

未使用入力の処理 (CMOS特有)

注意 CMOSデバイスの入力レベルは固定してください。

バイポーラやNMOSのデバイスと異なり、CMOSデバイスの入力に何も接続しない状態で動作させると、ノイズなどに起因する中間レベル入力が生じ、内部で貫通電流が流れて誤動作を引き起こす恐れがあります。プルアップかプルダウンによって入力レベルを固定してください。また、未使用端子が出力となる可能性(タイミングは規定しません)を考慮すると、個別に抵抗を介してVpoまたはGNDに接続することが有効です。

資料中に「未使用端子の処理」について記載のある製品については、その内容を守ってください。

初期化以前の状態 (MOS全般)

注意 電源投入時, MOSデバイスの初期状態は不定です。

分子レベルのイオン注入量等で特性が決定するため,初期状態は製造工程の管理外です。電源投入 時の端子の出力状態や入出力設定,レジスタ内容などは保証しておりません。ただし,リセット動作 やモード設定で定義している項目については,これらの動作ののちに保証の対象となります。

リセット機能を持つデバイスの電源投入後は,まずリセット動作を実行してください。



- 本資料の内容は予告なく変更することがありますので,最新のものであることをご確認の上ご使用ください。
- ◆文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して,当社は当社もしくは第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に 起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合,当社はその責を負うものではありませんの でご了承ください。
- 本資料に記載された回路,ソフトウエア,及びこれらに付随する情報は,半導体製品の動作例,応用例を説明するためのものです。従って,これら回路・ソフトウエア・情報をお客様の機器に使用される場合には,お客様の責任において機器設計をしてください。これらの使用に起因するお客様もしくは第三者の損害に対して,当社は一切その責を負いません。
- 当社は品質,信頼性の向上に努めていますが,半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として,人身事故,火災事故,社会的な損害等を生じさせない冗長設計,延焼対策設計,誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意願います。
- 当社は,当社製品の品質水準を「標準水準」,「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定 して頂く「特定水準」に分類しております。また,各品質水準は以下に示す用途に製品が使われること を意図しておりますので,当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。

標準水準:コンピュータ, OA機器, 通信機器, 計測機器, AV機器, 家電, 工作機械, パーソナル機器, 産業用ロボット

特別水準:輸送機器(自動車,列車,船舶等),交通用信号機器,防災/防犯装置,各種安全装置, 生命維持を直接の目的としない医療機器

特定水準: 航空機器, 航空宇宙機器, 海底中継機器, 原子力制御システム, 生命維持のための医療機器, 生命維持のための装置またはシステム等

当社製品のデータ・シート/データ・ブック等の資料で,特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は,必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。

M7 98.8

--- お問い合わせ先·

【技術的なお問い合わせ先】

NEC半導体テクニカルホットライン 電話 : 044-435-9494 FAX : 044-435-9608

(電話:午前9:00~12:00,午後1:00~5:00) FAX : 044-435-9608 E-mail : s-info@saed.tmg.nec.co.jp

【営業関係お問い合わせ先】

第二販売事業部	第三販売事業部		
東 京 (03)3798-6110, 6111,	東京 (03)3798-6151, 6155, 6586,		
6112	1622, 1623, 6156		
± III (0.10)500 5004 0407	水 戸 (029)226-1702		
\underline{U} /// (042)526-5981, 6167	広島 (082)242-5504		
松 本 (0263)35-1662	高 崎 (027)326-1303		
静 岡 (054)254_4794	鳥 取 (0857)27-5313		
,	太 田 (0276)46-4014		
金 沢 (076)232-7303	名古屋 (052)222-2170, 2190		
松 山 (089)945-4149	福 岡 (092)261-2806		
	東京 (03)3798-6110, 6111, 6112 立川 (042)526-5981, 6167 松本 (0263)35-1662 静岡 (054)254-4794 金沢 (076)232-7303		

【資料の請求先】

上記営業関係お問い合わせ先またはNEC特約店へお申しつけください。

【インターネット電子デバイス・ニュース】

NECエレクトロンデバイスの情報がインターネットでご覧になれます。 URL(アドレス)

ス) http://www.ic.nec.co.jp/